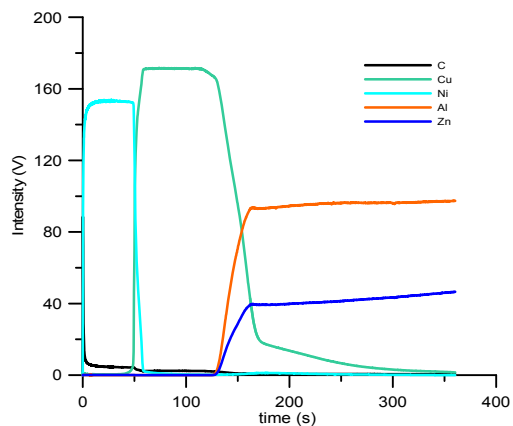
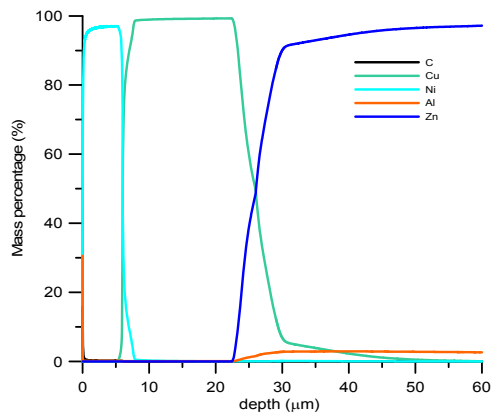


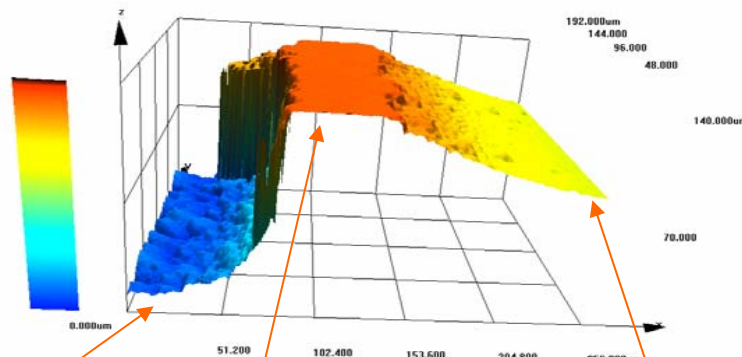
# Srovnání dat z GDOES a mikroskopu pro povlakovaný vzorek



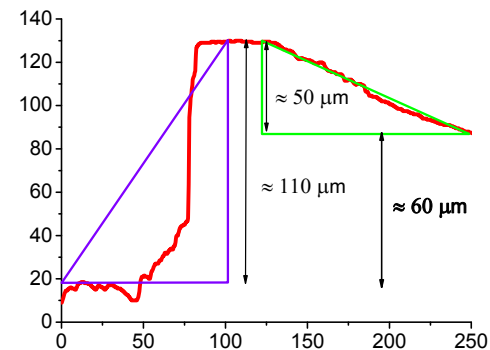
primární data z GDOES – osy grafu intenzita vs čas



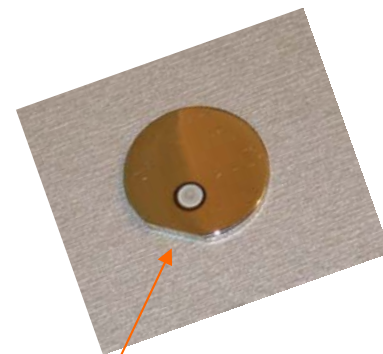
data po kvantifikaci – osy grafu hloubka krátera vs koncentrace v hmotnostních procentech



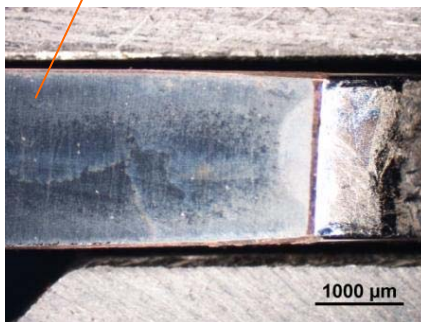
část dna krátera, valu z usazeného materiálu po analýze a původního povrchu - 3D zobrazení pomocí konfokálního mikroskopu



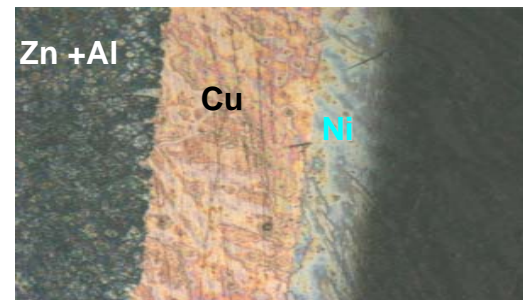
2D profil části krátera s uvedenou hloubkou



vzorek s kráterem po analýze GDOES



příčný řez (optický mikroskop), šipka udává směr pohledu



Detail na rozhraní povlaků – konfokální mikroskop

GDOES (optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem) umožňuje na základě interakce iontů Ar s povrchem získat informace o složení materiálu na základě změřeného emisního spektra.

Lze měřit složení vzorku nebo např. pro povlaky tzv. hloubkový profil – změnu složení materiálu v závislosti na „odprášené“ hloubce.